

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Сверхпроводящие резонаторы и зарядовые кубиты:
спектроскопия и квантовые операции. Часть I

А. В. Цуканов

404

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

Измерение линейных размеров кремниевых элементов нанорельефа с профилем,
близким к прямоугольному, методом дефокусировки электронного зонда РЭМ

*К. А. Валиев, В. П. Гавриленко, Е. Н. Жихарев, М. А. Данилова, В. А. Кальнов,
Ю. В. Ларионов, В. Б. Митюхляев, А. А. Орликовский, А. В. Раков,
П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов*

420

Фотопроводимость кремния с нанокластерами атомов марганца

М. К. Бахадырханов, К. С. Аюпов, Г. Х. Мавлянов, Х. М. Илиев, С. Б. Исамов

426

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ

Математическое моделирование влияния шероховатости поверхности фокусирующего
канала на угловые характеристики пучка быстрых нейтральных частиц

А. В. Дегтярев, В. П. Кудря, Ю. П. Машев

430

Моделирование влияния поперечного электрического поля на дрейфовую скорость
электронов в GAAS квантовой проволоке

А. В. Борздов, Д. В. Поздняков, В. М. Борздов, А. А. Орликовский, В. В. Вьюрков

436

ПЛАЗМА В ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Параметры и состав плазмы HBR в условиях тлеющего разряда постоянного тока

А. А. Смирнов, А. М. Ефремов, В. И. Светцов

443

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ И ОТВОДА ТЕПЛА

О возможности регулирования тепловых режимов типичного элемента радиоэлектронной аппаратуры или электронной техники с локальным источником тепла за счет естественной конвекции

Г. В. Кузнецов, М. А. Шерemet

452

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

Исследование методов калибровки процессных ОРС моделей VT-5 с переменным порогом чувствительности

И. А. Родионов, А. В. Амирханов, Н. С. Кукина, А. Л. Лохов, Е. П. Михальцов

468
